DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akkreditierung

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigt mit dieser **Akkreditierungsurkunde,** dass das Prüflaboratorium

TÜV Informationstechnik GmbH Unternehmensgruppe TÜV NORD
Prüflabor für IT-Qualität
Am TÜV 1, Gebäude ZGE, 45307 Essen

die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für die in der Anlage zu dieser Urkunde aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten erfüllt. Dies schließt zusätzliche bestehende gesetzliche und normative Anforderungen an das Prüflaboratorium ein, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 22.12.2023 mit der Akkreditierungsnummer D-PL-12022-01-00.
Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 6 Seiten.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: **D-PL-12022-01-00**

Berlin, 22.12.2023

Im Auftrag Johannes Feldmann MA., MA., MBA
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de).

Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV. Die DAkkS ist als nationale Akkreditierungsbehörde gemäß Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008 und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemäß Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser Verordnung von den nationalen Behörden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org
ILAC: www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12022-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: **22.12.2023**

Ausstellungsdatum: 22.12.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

TÜV Informationstechnik GmbH
Prüflabor für IT-Qualität
Am TÜV 1, 45307 Essen

mit dem Standort

TÜV Informationstechnik GmbH
Prüflabor für IT-Qualität
Am TÜV 1, 45307 Essen

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

1) **Prüfungen von Produkten aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT)**
2) **Prüfungen von Produkten aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) im Anwendungsbereich der EMVCo Security Prüfungen gemäß „EMVCo Security Evaluation Process", V5.3, Dezember 2022**

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12022-01-00

Das Labor erbringt die Prüfung anhand folgender Prüfverfahren

1. SOP No. 1: Side-Channel Measurement
2. SOP No. 2: Network Sniffing
3. SOP No. 3: ISO 7816 Data Traffic Capturing

Basierend auf

- ISO/IEC 15408-1:2009, ISO/IEC 15408-2:2008, ISO/IEC 15408-3:2008
- ISO/IEC 18045:2008
- ISO/IEC 15408:2022
- ISO/IEC 18045:2022
- ISO/IEC TS 23532-1:2021

Die Prüfungen erfolgen bei nachfolgenden Technologien und anhand nachfolgender Assurance Families. Alle Protection Profiles, deren Anforderungen gleich hoch sind wie oder unter den hier gelisteten EAL Niveaus liegen, können bewertet werden. Etwaige Anforderungen an die Assurance Class „Life-cycle support" (ALC) innerhalb eines Protection Profiles sind dabei nicht zu berücksichtigen.

Die Assurance Class ALC wird nicht durch das Prüflabor betrachtet, die Ergebnisse sind jedoch in die Prüfung zu integrieren.

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
ACE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
ACE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
ACE_MCO	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_CCO	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
APE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9	2	-

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
	H1, H2, H3, SC, SB		
ADV_ARC	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ADV_FSP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	6	EAL7
ADV_IMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	EAL7
ADV_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	EAL7
ADV_SPM	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ADV_TDS	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	6	EAL7
ADV_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
AGD_OPE	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
AGD_PRE	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ASE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ASE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ASE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ASE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	EAL7
ASE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9	1	EAL7

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
	H1, H2, H3, SC, SB		
ASE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	EAL7
ASE_TSS	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	EAL7
ASE_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
ATE_COV	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	EAL7
ATE_DPT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	4	EAL7
ATE_FUN	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	EAL7
ATE_IND	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	EAL7
ATE_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7
AVA_VAN	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	5	EAL7
AVA_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	EAL7

Verwendete Abkürzungen:

Code	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9
	Network Protocols	Communication protocols	Low-Level interfaces	Wireless	Hardware components protocols	Phone and VoIP	Mobile networks	Filtering	Intrusion detection

Code	H1	H2	H3
	Secure hardware components architectures	Hardware sensors, reactive technology	Platforms and applications security

Code	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
	Hardware architectures	Personal computer and server security	Embedded systems, microkernels	Virtualization	Applicative security	Databases	Web technologies

Code	SC	SB
	Smart Cards and similar devices	Hardware devices with security boxes

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
EN Europäische Norm
IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung